

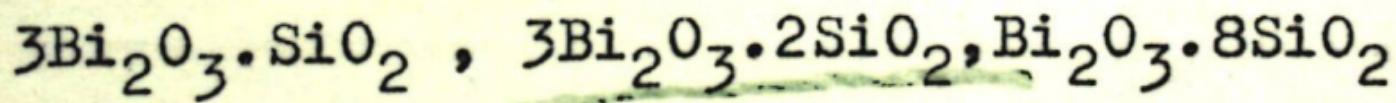
Si - Bi

1912

8561

Otin

1. Bull. sect. sci. acad. roumaine 1, 189
(1912-13)

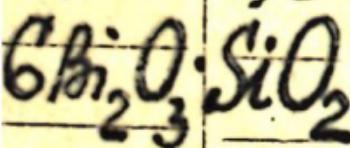
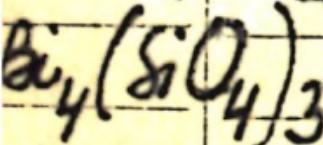
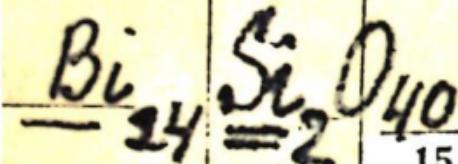


(Tm)

Circ. 500 Be



1963



15 Б400. Об окислах висмута. IV. Двойные системы Bi_2O_3 с SiO_2 , GeO_2 и SnO_2 . Gattow G., Fricke H. Über Wismutoxide. IV. Beitrag zu den binären Systemen des Bi_2O_3 mit SiO_2 , GeO_2 und SnO_2 . «Z. anorgan. und allgem. Chem.», 1963, 324, № 5-6, 287—296 (нем., рез. англ.)

Проведены синтез и рентгенографич. исследование (метод порошка, λCu - и $\text{Cr}-K_{\alpha}$) нек-рых фаз след. систем $\text{Bi}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ (I), $\text{Bi}_2\text{O}_3-\text{GeO}_2$ (II) и $\text{Bi}_2\text{O}_3-\text{SnO}_2$ (III). В системах I и II установлены фазы со структурным типом $\gamma^*-\text{Bi}_2\text{O}_3$: $\text{Si}_2\text{Bi}_{24}\text{O}_{40}$ $a = 10,098$, $\text{Ge}_2\text{Bi}_{24}\text{O}_{40}$,

сущ-ие,
крист. агр-ра

x · 1966 · 15



+2



10,145 Å; со структурным типом эвлитина: $\text{Bi}_4(\text{SiO}_4)_3$,
 a 10,299, $\text{Bi}_4(\text{GeO}_4)_3$ 10,526; со структурным типом
 $\delta^* \cdot \text{Bi}_2\text{O}_3$: $6\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ a 5,542, $6\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot \text{GeO}_2$ 5,572.
В системе III изучены соединения $6\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot \text{SnO}_2$, a 10,93,
 c 5,56, со структурным типом $\beta^* \cdot \text{Bi}_2\text{O}_3$ и BiSn_2O_7 с
искаженным структурным типом пирохлора. Приведены
результаты расшифровки порошкограмм всех изученных
соединений. Сообщение III см. РЖХим, 1964, 3 Б202.

С. Рыкова

Bieg SiO₅

1964
Avanziilles B., et al.

спеч
онп-па

1964, 18, №6, 1555.

(Cu. Ge-Bi) I

$\text{Si} - \text{Bi} - \text{O}$

1968

$\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$

2 Б767. Система $\text{Bi}_2\text{O}_3 - \text{SiO}_2$ Сперанская Е. И.,
Скориков В. М., Сафронов Г. М., Миткина
Г. Д. «Изв. АН СССР. Неорганические материалы», 1968,
4, № 8, 1374—1375

$\text{Bi}_4(\text{SiO}_4)_3$

Система $\text{Bi}_2\text{O}_3 - \text{SiO}_2$ изучена с помощью ДТА, визуаль-
но-политермич. и рентгеновского метода анализа и по-
строена равновесная фазовая диаграмма системы. В си-
стеме образуется два конгруэнтно-плавящихся соедине-
ния $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$ (т. пл. 880°) и $\text{Bi}_4(\text{SiO}_4)_3$ (т. пл. 1020°).

Эвтектика $\text{Bi}_2\text{O}_3 + \text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$ расположена при 99% Bi_2O_3
и 810° , эвтектика $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20} + \text{Bi}_4(\text{SiO}_4)_3$ при 65% Bi_2O_3
и 870° , эвтектика $\text{Bi}_4(\text{SiO}_4)_3 + \text{SiO}_2$ при 25% Bi_2O_3 и 970° .
Диаграмма состояния системы $\text{Bi}_2\text{O}_3 - \text{SiO}_2$ аналогична
диаграмме системы $\text{Bi}_2\text{O}_3 - \text{GeO}_2$.

Автореферат

Х. 1969. 2

Bj-Si-Cl

89-6125-2

1968

Timms P. L.,

Morgan Chew.

1968, 2, N. 2, 387-389

(Tm)

$\text{Bi}_x\text{SiO}_{5x+2}$ ВР-6062-XIV

1974

4 Б588. Состав кристаллов [двойного] окисла висмута и кремния. Hill O. F., Brice J. C. The composition of crystals of bismuth silicon oxide. «J. Mater. Sci.», 1974, 9, № 8, 1252—1254. (англ.)

(T_m)

Методом Чохральского в атмосфере кислорода или на воздухе выращены монокристаллы кубич. γ - Bi_2O_3 , стабилизированной кремнием. Состав этого соединения, установленный ДТА, $\text{Bi}_x\text{SiO}_{1.5x+2}$. Соединение плавится конгруэнтно при т-ре $895 \pm 5^\circ$. Изучена зависимость состава получаемых кристаллов от состава исходных расплавов. Показано, что из расплавов $\text{Bi}_x\text{SiO}_{1.5x+2}$ с $10 < x < 15$ могут быть выращены кристаллы, в к-рых величина x меняется в пределах 11,77—12,0. Приводятся параметры кубич. решетки синтезированных монокристаллов в зависимости от состава расплава; параметр решетки a изменяется от 11,7 до 12 А при увеличении значения x в расплаве.

Л. С. Гарашина

Х. 1975 № 4

Bi₂O₃ · SiO₂

1977

17 Б1100. Превращение метастабильной δ -формы $6\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ и ее расплава в стабильную γ -форму, вызванное механическим взбиванием. Ito Setsuro, Kokubo Tadashi, Tashiro Megumi. Transformation of metastable δ -form of $6\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ and its melt into stable γ -form induced by mechanical tapping. «Bull. Inst. Chem. Res. Kyoto Univ.», 1977, 55, № 5, 457—465 (англ.)

(T_m)

Исследованы процессы кристаллизации в платиновом тигле из переохлажденного расплава $6\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ (I) при 740 — 700° (т. п.л. 900°). Показано, что при скорости охлаждения $60^\circ/\text{мин}$ образуется метастабильная δ -фаза I, устойчивая после охлаждения и содержащая небольшие кол-ва $\alpha\text{-Bi}_2\text{O}_3$ при более медленном охлаждении. В случае интенсивного взбивания жестким стержнем из спеченой окиси алюминия в тех же условиях кристаллизуется γ -фаза I. Начавшие выпадать кристаллы δ -I при интенсивном перемешивании в расплаве переходят в γ -I. В случае размола δ -I в шаровой мельнице при т-ре ниже 50° также наблюдается превращение в γ -I. Полученные результаты объяснены с точки зрения образования кавитац. пузырей в расплаве

д. 1948 № 14

и снижения энергии активации перехода за счет образования дислокаций в δ-I, вызванных терм. и мех. напряжениями.

Г. Л. Апарников

5.

и
ется.
т

$\text{Bi}_2\text{O}_3 - \text{SiO}_2$

1977

Mitrova J. Ya. et al.

Poluprovodn. Materialy i
Tekhn. Primenenie. 1977, 126-31
From Ref. Zh., Khim. 1977, Abstr.
No. 19B 1051

(T_{c2})

att. $\text{PbO-SiO}_2 - I$

Bi₂SiO₄, 1978

20 Б601. Синтетический фенакит. Beckman K. L.,
Moritz H. W., Hugst V. J. Synthetic phenacite. «Ga
J. Sci.», 1978, 36, № 1, 13—15 (англ.)

Монокристаллы синтетич. фенакита (Bi_2SiO_4) выра-
щены в гидротермальных условиях при т-ре 600° и давл.
13 600 атм. Кристаллы светло-сер. цвета, длиной 2 мм,
ограничены двумя гексагоn. призмами {1010} и {1120}
и ромбоэдром {2112}. Уточненные параметры решетки:
 $a = 12,474$, $c = 8,259$ Å, ф. гр. $R\bar{3}$, ρ (изм.) 2,97, ρ (выч.)
2,956. Показатели преломления $\omega = 1,668$ и $\varepsilon = 1,657 \pm$
 $\pm 0,001$. Приведены индицированные рентгенограммы
синтетич. фенакита в сравнении с данными для при-
родных кристаллов.

Г. А. Емельченко

паралл.
фенакитов

2.1978, №20

$\text{Bi}_4(\text{SiO}_4)_3$

1981

Rao B. R., et al.

metastable
cb - ba

Indian J. Pure and
Appl. Phys., 1981, 19,
N1, 87-89.



(cu $\text{Bi}_4(\text{GeO}_4)_3$; ?)

1981

14 Б862. Фазовые равновесия в системах Ga_2O_3 — Bi_2O_3 — ЭO_2 (где Э=Si и Ge). Скориков В. М., Рза-Заде П. Ф., Каргин Ю. Ф., Джалалад-

инов Ф. Ф. «Ж. неорган. химии», 1981, 26, № 4, 1070—1074.

Методами ДТА и рентгенофазового анализа изучены фазовые равновесия в тройных системах Ga_2O_3 — Bi_2O_3 — ЭO_2 (Э=Si и Ge). Выявлены поля первичной кристаллизации исходных компонентов, двойных соединений $6\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot \text{ЭO}_2$, $2\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{ЭO}_2$, $25\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot \text{Ga}_2\text{O}_3$, $2\text{Ga}_2\text{C} \cdot \text{Bi}_2\text{O}_3$, а также определены составы эвтектик. Получено тройное инконгруэнтно плавящееся соединение $12\text{Ga}_2\text{O}_3 \cdot \text{Bi}_{12}\text{ЭO}_{20}$ (92 мол. % Ga_2O_3 +8 мол. % $\text{Bi}_{12}\text{ЭO}_{20}$). Установлены области взаимной р-римости фаз со структурой типа силленита и р-римость Ga_2O_3 в этих соединениях. Выращены монокристаллы $\text{Bi}_{12}\text{ЭO}_{20}$, легированные Ga_2O_3 , и определено изменение параметра ячейки в зависимости от состава.

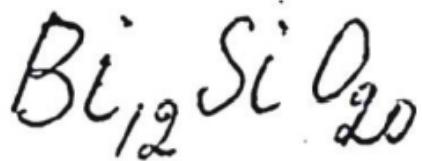
Резюме

 $\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ $\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot \text{GeO}_2$ $\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot \text{Ga}_2\text{O}_3$

и гп.

разраб.
изобретен

2 1981/114



1982

Бабонос Г. А., Некрасова
Е. А., и др.

Сибирь-
типа

Физ. магн. магн.,
1982, 24, N6, 1612-1618.

(см. $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$; I)

Bi₂SiO₅

1984

18 Б2045. Выращивание и некоторые свойства монокристаллов Bi₂GeO₅ и Bi₂SiO₅. Фирсов А. В., Скороходов Н. Е., Астафьев А. В., Буш А. А., Стефанович С. Ю., Веневцев Ю. Н. «Кристаллография», 1984, 29, № 3, 509—512

Методом спонтанной кристаллизации из расплавов смесей Bi₂O₃·XO₂ (X=Ge, Si) получены монокристаллы Bi₂XO₅. Проведены рентгенографич., ИК-спектроскопич. исследования, а также изучение их диэлектрич., пироэлектрич. и нелинейных оптич. св-в. В кристаллах Bi₂SiO₅ при 610 К обнаружен фазовый переход из полярного в неполярное состояние. Кристаллы Bi₂GeO₅ являются полярными в области т-р 100—800 К. Показано, что это соединение является сегнетоэлектриком с T_c>800 К.

Резюме

X.1984, 19, N 18

Bi - Si

1985

106: 2026506 The Bi-Si (bismuth-silicon) system. Oleśniski, R. W.; Abbaschian, G. J. (Dep. Mater. Sci. Eng., Univ. Florida, Gainesville, FL 32611 USA). *Bull. Alloy Phase Diagrams* 1985, 6(4), 359-61, 385-6 (Eng). The Bi-Si phase diagram was critically assessed. Parameters for the equations for heat and entropy of alloying are given.

paperback
unpublished

SH, SS;

c.A.1987, 106, N 24

$\text{Bi}_4[\text{SiO}_4]_3$ 1988

Семёнов Ю.В., Береговская Ю.Н.,

Термодинамические свойства
фазы итана.

ДИФ; Текущий доклад на II Всесоюзном
симпозиуме 6-8 сентября 1988г,
г. Мисс, г. Р., Свердловск, 1988г,
143.

$B_{14}Si$

B_6Si

17
tr)

1988

23 Б3094. Особенности формирования силицидов бора при синтезе из элементов. Власова М. В., Казаев Н. Г., Макаренко Г. Н., Юхименко Е. В. «Изв. АН СССР. Неорган. матер.», 1988, 24, № 7, 1116—1120

С использованием данных ЭПР, хим. и рентгенодифракц. анализов проведено исследование процесса структурных и фазовых перестроек в смесях $nB-Si$, отвечающих составам B_4Si , B_6Si и $B_{14}Si$ при последоват. повышении т-ры обработки. Установлено, что взаимодействие в смесях протекает с образованием тв. р-ров Si в B и B в Si. Существование предельной конц-ии тв. р-ра Si в B предполагает формирование соотв. фаз на основе тв. р-ра B в Si, переходящего при высоких конц-иях B в аморфное состояние. Распад B_4Si при $T_{обр} > 1373$ К сопровождается выделением на границах зерен B_6Si прослоек аморфного кремния, к-рый при дальнейшей термообработке частично переходит в крист. форму. Предложена схема структурно-фазовых превращений в исследуемых системах при термообработке.

Автореферат

Х. 1988, № 23

$\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot x \text{SiO}_2$

1990

$0 < x \leq 1$

24 Б3119. Система $\text{Bi}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$. The system Bi_2O_3-
 SiO_2 / Takamori Takeshi // J. Amer. Ceram Soc.— 1990.
— 73, № 1.— С. 158—160.— Англ.

Методами ДТА и РФА изучены фазовые соотношения в системе Bi_2O_3 (I)— SiO_2 (II). Представлена фазовая диаграмма системы до 25 мол.% II. Установлено образование метастабильной γ -фазы в области $61 \cdot x \text{II}$ ($0 < x \leq 1$). В области низких конц-ий II и т-р образуется смесь α - и γ -фаз, а при т-рах выше 730°C — смесь δ - и γ -фаз. В области 14,2—14,5 мол.% II образуется узкая область тв. р-ров $61 \cdot \text{II}$. Макс. т. пл. образцов в системе соответствует этому составу и составляет $\sim 900^\circ\text{C}$.

Л. Г. Титов

x. 1990, N24

Bi₄Si₃O₁₂

1991

5 Е433. Стабильное и метастабильное фазовые равновесия в системе Bi₂O₃—SiO₂ / Каргин Ю. Ф., Жереб В. П., Скориков В. М. // Ж. неорган. химии.— 1991.— 36, № 10.— С. 2611—2616

Методами ДТА и РФА изучены фазовые равновесия в системе Bi₂O₃—SiO₂, построены диаграммы состояния для стабильного и метастабильного равновесий. Установлено, что эвлитин Bi₄Si₃O₁₂ плавится инконгруэнтно при 1293 К. При охлаждении расплава образуются фаза Bi₂SiO₅, кристаллизующаяся с конгруэнтным максимумом при 1123 К, и твердые растворы на основе α-Bi₂O₃.

(Tm)

φ. 1992, № 5

$\text{Bi}_4(\text{SiO}_4)_3$
zircon

1991

Semenov Yu. V., Sam-
tirov N., et al.,

Intern Symposium on
Calorimetry, Moscow,
23-28 June 1991, Abstracts,

31.

, ΔH , $H_T - H_0$,
(ρ , 13-310K)



31

$\text{Bi}_{12}\text{Si}_x\text{O}_{20-y}$ (kp)

1992

116: 182580h Thermochemical study of gamma bismuth oxide based single crystals. Suleimenova, G. S.; Skorikov, V. M. (N. S. Kurnakov Inst. Gen. Inorg. Chem., Moscow, USSR). *Thermochim. Acta* 1992, 196(1), 203-11 (Eng). The sp. heats of $\text{Bi}_{12}\text{M}_x\text{O}_{20-y}$, ($\text{M} = \text{Si}, \text{Ge}, \text{Ti}, \text{Ga}, \text{Fe}, \text{Zn}; x \leq 1; 0 \leq y \leq 0.7$) single crystals were detd. by DSC at 50-950°. The measurements were conducted on single crystal specimens at a heating rate of 20°C/min in air. The use of the DSC technique provided an insight into a scattering of the sp. heat curves of bismuth germanate and silicate samples due to the changes in the electronic contribution in the sp. heat related to the defect structure. Changes in the sp. heat of the crystal specimens treated in atmospheres with different oxygen partial pressures were detected. The inclusions of a metastable δ -phase Bi_2O_3 are due to exothermal effects at 250-350°.

(P)

(+)

$\text{Bi}_{12}\text{Ti}_x\text{O}_{20-y}$, Bi_{12}

$\text{Bi}_{12}\text{Si}_x\text{O}_{20-y}$, $\text{Bi}_{12}\text{Ti}_x\text{O}_{20-y}$,
 $\text{Ba}_x\text{O}_{20-y}$, $\text{Bi}_{12}\text{Fe}_x\text{O}_{20-y}$,
 $\text{Bi}_{12}\text{Zn}_x\text{O}_{20-y}$

C. A. 1992, 116, N 18

Bixi Diao

1994

Xu, Yifan; Li Tonggeng;
et al.,

Cp

Wuji Cai-liao Xuebao 1994,
9(1), 15-21

(Cu-diaByO₇(K); I)

? - $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$

1995

) 24 Б3201. Характеристики затвердевания метастабильного $\delta\text{-}\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$ и стабильного $\gamma\text{-}\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$. Solidification characteristics of metastable $\delta\text{-}\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$ and stable $\gamma\text{-}\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$: Pap. Int. Symp. Atom. Bond. at Intern. Interfaces: Modell. and Sectrosc., Schloss Ringberg, 24—28 Apr. 1995 / Fu Senlin, Ozoe Hiroyuki // J. Phys. D. — 1996. — 29, № 7. — С. 2032—2043. — Англ.

(T_m)

X. 1996, N 24

$\text{Bi}_4(\text{SiO}_4)_3$

1996

125: 38200c Heat capacity and thermodynamic properties of eulytite $\text{Bi}_4(\text{SiO}_4)_3$. Gurevich, V. M.; Gavrichev, K. S.; Gorbunov, V. E.; Khodakovskii, I. L. (Inst. Geokhim. Anal. Khim. im. V. I. Vernadskogo, Moscow, Russia 117975). *Geokhimiya* 1996, (1), 90-2 (Russ.). The heat capacity (C_p) of eulytite grown by hydrothermal method was measured at 11-301 K in adiabatic calorimeters. In a plot of C_p vs. temp. (°K) anomalous departure of C_p from linearity was obsd. at 47-66 K. The C_p values detd. were used to calc. the entropy and change in enthalpy [$H^\circ(T) - H^\circ(0)$] over the $T = 11-301$ K range.

(C_p , ρ -III)
125-III

c.a. 1996, f25, n4

1998

Bi_2SiO_5

130: 228366n Phase diagram of Bi_2O_3 - SiO_2 system. Fei, Yi-Ting; Fan, Shi-Ji; Sun, Ren-Ying; Ishii, M. (Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, Peop. Rep. China 200050). *Wuji Cailiao Xuebao* 1998, 13(6), 798-802 (Ch), Kexue Chubanshe. Stable and metastable phase equil. in a binary Bi_2O_3 - SiO_2 system were studied and a complete phase diagram of the system was proposed with DTA and XRD. A peritective reaction $\text{L} + \text{SiO}_2 \leftrightarrow \text{Bi}_4\text{Si}_3\text{O}_{12}$ at the SiO_2 -rich side of the stable phase diagram was identified to have a peritectic temp. at about 1030°C and a peritectic point close to the end of the peritectic isotherm. $\text{Bi}_4\text{Si}_3\text{O}_{12}$ was obsd. to be a nearly congruently melting compd. and liqs. of the peritectic reaction were identified by the quenching microstructure method. Crystn. behavior of the Bi_2O_3 - SiO_2 system was also investigated. The results show that metastable Bi_2SiO_5 crystallizes out at 845°C.

(Тхрученко)

C.A., 1999, 130, N17

Bi₂SiO₅

1999

131: 50185h Study on the metastable phase equilibrium of Bi₂-SiO₅. Fei, Yiting; Fan, Shiji; Sun, Renying; Wang, Jinchang; Xie, Huaqing (Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, Peop. Rep. China 200050). *Guisuanyan Xuebao* 1999, 27(2), 230-236 (Ch), Zhongguo Guisuanyan Xuehui. Metastable phase equil. of Bi₂O₃-SiO₂ system and its compd. Bi₂SiO₅ were studied with DTA and XRD. The investigation shows that metastable phase Bi₂SiO₅ crystallizes at about 845°C during cooling. Upon cooling the melt, Bi₂-SiO₅ tends to crystallize by nucleating spontaneously in a wide range of Bi₂O₃-SiO₂ system (more than 30% SiO₂, in mole) and can be cooled to room temp. without any phase transition and it will exist stably at room temp.

T KU CHAN

C.-Q., 1999, 131, N4

Bi₂SiO₅

2000

F: Bi₂O₃-SiO₂

P: 1

Bi₂SiO₅

02.13-19Б3.82. Режим кристаллизации системы Bi[2]O[3]-SiO[2]. Crystallization behavior of Bi[2]O[3]-SiO[2] system / Fei Y. T., Fan S. J., Sun R. Y., Xu Y., Ishii M. // J. Mater. Sci. Lett. - 2000. - 19, N 10. - C. 893-895. - Англ.

С целью уточнения фазовой диаграммы системы Bi[2]O[3]-SiO[2] проведены исследования фазовых равновесий, фазовых отношений и кристаллизационных свойств этой системы. Результаты измерений с использованием методов ДТА и дифракции рентгеновских лучей в сочетании с данными других авторов позволил построить фазовую диаграмму системы Bi[2]O[3]-SiO[2] для температур от 60 1710рС. Библ. 11.